

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025년 4월 24일 (24.04.2025)



(10) 국제공개번호
WO 2025/084857 A1

- (51) 국제특허분류:
G01R 31/28 (2006.01) *G01N 21/95* (2006.01)
G06T 7/70 (2017.01) *G01N 21/88* (2006.01)
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 21/67* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2024/015900
- (22) 국제출원일: 2024년 10월 18일 (18.10.2024)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2023-0140575 2023년 10월 19일 (19.10.2023) KR
10-2023-0140845 2023년 10월 20일 (20.10.2023) KR
10-2023-0142139 2023년 10월 23일 (23.10.2023) KR
10-2023-0153756 2023년 11월 8일 (08.11.2023) KR
10-2023-0171629 2023년 11월 30일 (30.11.2023) KR
10-2024-0020167 2024년 2월 13일 (13.02.2024) KR
10-2024-0099488 2024년 7월 26일 (26.07.2024) KR

AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

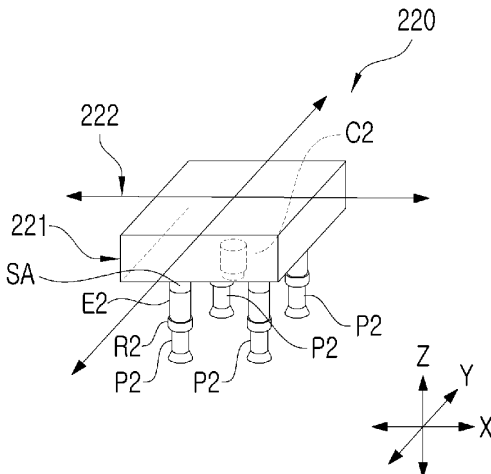
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (71) 출원인: 주식회사 테크윙 (TECHWING, INC.) [KR/KR]; 18487 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 (KR).
- (72) 발명자: 나윤성 (NA, Yun Sung); 31068 충청남도 천안시 동남구 향교1길 114-7 (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 빛파소금 (LIGHT AND SALT PATENT AND LAW FIRM); 08506 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 1-312호 (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: HANDLER FOR TESTING ELECTRONIC COMPONENTS, AND METHOD THEREOF FOR ALIGNING ELECTRONIC COMPONENTS

(54) 발명의 명칭: 전자부품 테스트용 핸들러 및 전자부품 테스트용 핸들러의 전자부품 정렬방법



(57) Abstract: The present invention relates to a handler for testing electronic components and a method for aligning the electronic components. The present invention comprises: a transfer shuttle for transferring an electronic component; a test table on which the electronic component is loaded; a second hand for moving the electronic component between a transfer table of the transfer shuttle and the test table, wherein the second hand corrects the position of the electronic component on the transfer table so as to move the electronic component to a correct position area of the test table. Applying the present invention reduces the time required to position electronic components on the test table and thus can improve the processing capacity of the handler.

(57) 요약서: 본 발명은 전자부품 테스트용 핸들러 및 그 전자부품 정렬방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 전자부품들을 운반하는 운반셔틀; 전자부품들이 적재되는 테스트테이블; 운반셔틀의 운반테이블과 테스트테이블 간에 전자부품을 이동시키는 제2핸드; 를 포함하고, 제2핸드는 운반테이블에 있는 전자부품의 위치를 보정하여 테스트테이블의 정위치구역으로 이동시킨다. 본 발명이 적용되면 전자부품을 테스트테이블에 배치시키는데 소요되는 시간을 줄여 핸들러의 처리 용량을 향상시킬 수 있다.

WO 2025/084857 A1